ПОЛУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОБРАЖЕНИЯ В DELPHI

Студент гр.11304117 Перуанский В. В. Ст. преподаватель Гундина М. А. Белорусский национальный технический университет

Рассмотрим возможность реализации приложения, позволяющего автоматически определять некоторые статистические характеристики изображения, а именно, среднее значение (меру средней яркости); стандартное отклонение (меру средней контрастности); гладкость (меру отно-

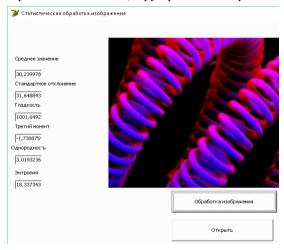


Рис. 1. Статистические характеристики изображения вольфрамовой нити в лампах накаливания под микроскопом

сительной гладкости яркости области); третий момент, характеризующий асимметричность гистограммы; однородность изображения (меру равномерности изображения); энтропию (меру случайности).

Остановимся на процессе создания такого приложения в среде Delhi: Для начала нужно создать удобный интерфейс, для этого добавляем для вывода всех значений кнопки, текстовые поля, метки (рисунок 1).

Среднее значение считается по следующей формуле: $m = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p(z_i)$, где z_i – интенсивность текущего пикселя, $p(z_i)$ – вероятность его возникновения; стандартное отклонение:

 $\sigma=\sqrt{\mu_2\left(z\right)}=\sum_{i=0}^{L-1}(z_i-m)^2p(z_i)$; гладкость: $R=1-\frac{1}{1+\sigma^2}$; третий момент: $\mu_3=\sum_{i=0}^{L-1}(z_i-m)^3p(z_i)$; однородность снимка: $U=\sum_{i=0}^{L-1}p^2(z_i)$; энтропия изображения: $e=-\sum_{i=0}^{L-1}p(z_i)\log_2p(z_i)$.